# 軟X線XAFS 測定によるリグニン構造の解析

## Local structure analysis of silicon in lignin by XAFS

## <u>吉村 晃一</u>ª, 扇 剛士<sup>b</sup>, 石橋 良晃<sup>b</sup>, 中西 康次<sup>c</sup>, 太田 俊明<sup>c</sup> <u>Koichi Yoshimura</u><sup>a</sup>, Takeshi Ougi<sup>b</sup>, Yoshiaki Ishibashi<sup>b</sup>, Koji Nakanishi<sup>c</sup>, Toshiaki Ohta<sup>c</sup>

<sup>a</sup>旭有機材工業株式会社,<sup>b</sup>ハリマ化成株式会社,<sup>c</sup>立命館大学 SR センター <sup>a</sup>ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO.,LTD., <sup>b</sup>HARIMA CHEMICALS, INC., <sup>c</sup>The SR Center, Ritsumeikan University

パルプ黒液から回収したリグニン中に含まれる Si の結合状態を XAFS 解析により、確認した。測定の結果、 麦わらよりソーダ法にて製造したパルプから回収したリグニン中では、Si 周りの局所構造は、SiO<sub>2</sub> であること が同定された。一方、サルファイトパルプ黒液を原料とするリグニンスルフォン酸塩においては、蛍光収量法 と全電子収量法で、スペクトル形状は大きく変化しており、試料のバルクと表面で異なった Si の化学状態が存 在することが確認された。

The chemical structure of lignin purified from black liquor has been studied. This work reports on Si K-XANES in the lignin. In Soda lignin, local structure of silicon is observed as SiO<sub>2</sub>. In Lignosulphonates, spectrum at the surface is different from spectrum of the bulk .

#### Keywords: lignin, bio-mass, black liquor, Si K-XANES, SiO2

本研究では、麦わらパルプ黒液より回収したリグ ニンが Si を 10 %程度含む点に着目した。リグニン に含まれる Si の結合状態の解析を通じて、リグニン 構造における有機 Si 複合体の存在の可能性を探る とともに、リグニンの有効活用に向けた知見を得る ことを目的とする。

麦などのイネ科植物は Si 集積植物として知られ ており、植物体内における Si の化学形態については、 吸収されたケイ酸が重合して、固体の非晶質含水シ リカとなり、構造体として働くことが報告されてい るが、その詳細は明らかではない[1,2,3]。

本研究では、上記草本系リグニンの Si の結合状態を明らかにするために、XAFS 測定により、局所

構造解析をおこなった。

実験: Si K吸収端XANES(Si K-XANES)測定は立命 館大学BL-10で行われた。分光結晶にはInSb(111)を 用い、入射X線のエネルギーは石英のホワイトライ ンを1846.8 eVとして校正された[4]。試料電流による 全電子収量法(TEY)とシリコンドリフト検出器によ る部分蛍光収量(PFY)の同時測定を行うことで、表面 近傍とバルクそれぞれの情報を得た。

Si K-XAFS用試料として下記を準備した。 [麦わらリグニン]

- ・リグニン原料品:麦わらパルプ黒液の乾燥品
- ・高純度リグニン:「リグニン原料品」の精製品 (ハリマ化成開発品)
- [リグニンスルフォン酸塩 (日本製紙ケミカル製)] ・サンエキスP252 (P252)
  - : サルファイトパルプ製造時に副生されるリグニ ンスルフォン酸ナトリウム塩
- ・バニレックスHW(HW)
- :リグニンスルフォン酸の一部を脱スルフォン化 したもの。 ナトリウム塩
- ・パールレックスNP(NP)
  - :高純度高分子量リグニンスルフォン酸。ナトリ ウム塩。

### 様式3



Figure 1. 観測された麦わらリグニンと比較試料の Si K-XANES スペクトル(a)とその収端近傍の拡大スペクトル(b).

結果、および、考察: Fig. 1に観測された麦わら リグニンと比較のため観測された数種のSiO<sub>2</sub>系試 料のSi K-XANESスペクトルを示す。Fig. 1より、そ の吸収端位置やスペクトル形状から、リグニン原料 品、ならびに、高純度リグニンともにSi周りの局所 構造はSiO<sub>2</sub>型であることが同定できる。

「リグニン原料品」に関して、PFYスペクトルは ホワイトラインのピーク位置やホワイトラインの 高エネルギー側のショルダー構造など、そのスペク トル形状が水ガラス乾燥品に非常に近かった。この ショルダー構造はSiO2中のNa量の増加とともに大 きくなることがG.S. Hendersonによって調べられて おり[5]、これより「リグニン原料品」のSiの化学状 態は水ガラス乾燥品に近いNaを含んだシリカゲル であることが考えられる。一方、TEYスペクトルは ホワイトラインのピーク位置は水ガラス乾燥品と 一致するものの、ホワイトラインの高エネルギー側 のショルダー構造があまり見られず、ガラスに近い スペクトル形状であった。これは「リグニン原料品」 の粉末の表面近傍はNaの含有量がバルクに比べて 少なく、ガラスに近い状態になっているためである と考えられる。

「高純度リグニン」に関して、TEYスペクトルは ホワイトラインのピーク位置やホワイトラインの 高エネルギー側の微細構造などがガラスに非常に 近かった。一方、PFYスペクトルはリグニン原料品 に近い形状であった。これより、バルクではやや Naを含んだSiO<sub>2</sub>であるものの、表面近傍ではかな りNa量が少なく、ほとんどガラスのような状態に なっていると考えられる。「リグニン原料品」が精 製される過程で多くのNaイオンが流出したことが スペクトル形状から推察できる。

Fig. 2 にリグニンスルフォン酸塩と比較試料の Si K-XANES スペクトルを示す。比較試料の Si(CH3)4、  $Si(CH_3)_3(OCH_3)$ ,  $Si(CH_3)_2(OCH_3)_2$ ,  $Si(CH_3)(OCH_3)_3$ , Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>はD.G.J. Sutherland らのデータを引用した [6]。すべてのリグニンスルフォン酸塩試料に共通し て、PFY と TEY でスペクトル形状は大きく変化し た。これは試料のバルクと表面で明らかに異なった Siの化学状態が存在することを示している。「P252」、 「HW」、「NP」の TEY スペクトルに関して、ピーク 強度は異なるものの、いずれのホワイトラインも 1844 eV 程度に現れており、Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OCH<sub>3</sub>)と同じ位 置であった。一方、PFY スペクトルはプリエッジ部 分が歪んだ、理想的でないスペクトルが得られたが、 Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OCH<sub>3</sub>)とSiO<sub>2</sub>のホワイトラインからのピー クが見られ、主にはこの2種の状態の足し合わせで 構成されていると考えられる。これら以外に「P252」 と「HW」には1849 eV 付近になだらかなショルダー 構造が見られた。この位置にホワイトラインが見ら れるのは酸素6配位のSiO2:ステイショバイトであ るが、高圧・高温下でないと生成されないため、こ の可能性は低く、スペクトルの歪みが原因ではない かと推察している。

TEY と PFY の結果を合わせて考えると、表面から数マイクロメートルオーダーで、Si 原子はSi(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OCH<sub>3</sub>)的な局所構造であると考えられる。この界面上の Si-C 結合や Si-O-C 結合形成への、リ

グニン構造の寄与については、現在のところ明確で はない。

### 参考文献

[1] 松永俊朗:植物体内でのケイ素の化学形態,日本 土壌肥料学雑誌,75,387-391 (2004).

[2] Exley, C. : Silicon in life: a bioinorganic solution to bioorganic essentiality. *J. Inorg. Biochem.* **69**, 139-144 (1998).

[3] Perry, C. C. and Keeling-Tucker, T. : Biosilicification : the role of the organic matrix in structure control. *J.Biol. Inorg. Chem.*. **5**, 537-550 (2000).

[4] K Nakanishi, T Ohta : Verification of the FEFF simulations to K-edge XANES spectra of the third row elements, *J. Phys.: Condens. Matter* **21**, 104214 (2009).

[5] G S. Henderson : A Si K-edge EXAFS/XANES study of sodium silicate glasses, *J. Non-Cryst. Solids* **183**, 43-50 (1995).

[6] D. G. J. Sutherland *et al.* : Si *L*- and *K*-edge x-ray-absorption near-edge spectroscopy of gas-phase  $Si(CH_3)_x(OCH_3)_{4,x}$ : Models for solid-state analogs, *Phys. Rev. B* **48**, 14989 (1993).



 Figure 2. 観測されたリグニンスルフォン酸塩と

 比較試料のSiK吸収端XANESスペクトル.

 (※)印の比較試料は文献[6]より引用された.